Hooken

1.5 μm

δ-3μm ~10%

after bonding で
machine に → 設定で

0.2 mm cut に 曲げ f0 ずれるきっかけ
cut をはかって対策。

平成１０年６月１９日
ＩＨＩ

ＳＤＴＬ RF試験

日時 平成１０年６月１８日
場所 ＫＥＫ ＰＳ南実験室
作業者 バシュチェンコ氏（ＩＮＲ）、山本（ＩＨＩ）

$\frac{30000}{36000} \sim 83\%$

① surface

② short だから
対 contact の
effect 大

１．試験項目

１）カップリングループ調整
２）フランジのＲＦコンタクトの効果
３）ダミーチューナー、ダミーカップラー影響
４）高次モード測定

２．結果

１）カップリングループ調整

１．１）貸与いただいたカップリングループのサイズがＳＤＴＬに適合しないためループの長さを伸長した。入力側８４mm、出力側７５mmで測定可能となる。周波数、Ｑはプロット参照。Ｑ約３００００。２）～４）の計測はこの状態で行った（図１－１）。

１．２）カップリングループのＱに対する影響を軽減するため、ループの空洞内への突き出し量と回転角度を変えて最適値を求めた（図１－２）。プロット参照。Ｑ約３００００。

２）フランジのＲＦコンタクトの効果

２．１）ＲＦコンタクトの状態を向上させるためフランジを増し締め。Ｑを向上させる効果なし。

δf 改善 約10%低下

２．２）フランジのＲＦコンタクト交換（フランジ２について行った）
変化はほとんどない。

３）ダミーチューナー、ダミーカップラー影響

それぞれ、あるいは両方とも取り外しｆ、Ｑを測定。プロット参照。
Ｑ：約２６０００（ダミーカップラーなし）～約３０７００（ダミーチューナーなし）

9

↑ おくるぞれを

４）高次モード測定

ＲＦコンタクトに電流が流れないモードで計算値と実測を比較するために行った。測定値はプロット参照。同モードを計算により求めなければ比較できないため参考のみ。